(51) TESTING APPARATUS FOR ELECTRONIC PART

(11) 3-152480 (A) (43) 28.6.1991 (19) JP

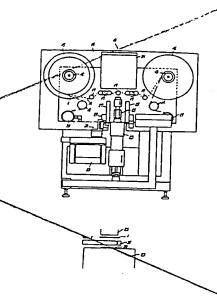
(21) Appl. No. 64-291731 (22) 9.11.1989

(71) JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD(1) (72) TAKESHI KANEKO(1)

(51) Int. Cl3. G01R31 00.

PURPOSE: To adjust the position with high accuracy by detecting the position of a tape and a testing tool, adjusting the position of both thereby to prevent generation of a shift or displacement between the tape and testing tool.

CONSTITUTION: A TAB (Tape Automated Bonding) tape 1 with a conductive part formed on the surface thereof is driven by the rotation of sprockets 20, 21, and fixed by tape clamps 27, 28. A measuring apparatus 23 brings a testing tool 50 in touch with the tape 1 to measure the conductive state of the conductive part. A position detecting device of an apparatus 30 detects the position of both the tape 1 and the confronting tool 50. At this time, the tape 1 and the tool 50 are illuminated by a lamp. The reflecting light is photographed by a camera through a head 38 of the apparatus 23. Accordingly, the correct position of each of the tape 1 and tool 50 can be detected. A displacement between the tape 1 and tool 50 is obtained through comparison of the positions. The apparatus 23 is moved based on the displacement to adjust the position of the tape 1 to the tool 50.



(54) FLYING PROBE HEAD

(11) 3-152481 (A) (43) 28.6.1991 (19) JP

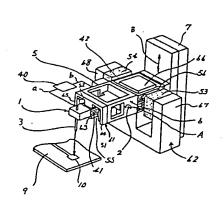
(21) Appl. No. 64-292762 (22) 9.11.1989

(71) NEC CORP (72) HIROBUMI INOUE

(51) Int. Cl5. G01R31/00,G01R31/26

PURPOSE: To weaken the impact when a probe is in touch with a pad of an object to be tested thereby to prevent the damage of the pad by providing a swaying arm which is able to swing up and down around an oscillating shaft supported by the other swaying arm which is also movable up and down, at an end of which is mounted the probe.

CONSTITUTION: A swaying arm 1 brings a probe 3 in touch with an pad 10 of an object 9 to be tested. The probe 3 is provided at one end of the swaying arm 1 connected to a moving coil 41. An oscillating shaft 2 is held by the other swaying arm 6 at the other end. Accordingly, the swaying arm 1 is able to swing up and down at a fulcrum of the oscillating shaft 2. The arm 6 supports the oscillating shaft 2 at the center of the arm. A magnetic circuit 55 comprised of a magnet 51 and a yoke 61 at one end of the arm 6 impresses a magnetic flux in a direction perpendicular to the oscillating direction of the coil 41. On the other hand, a moving coil 42 provided at the other end of the arm 6 is coupled to a slide rail 7, so that the moving coil 42 is movable up and down. A magnetic circuit 56 comprised of a magnet 53 and a yoke 62 impresses a magnetic flux in a direction perpendicular to the oscillating direction of the coil 42. A control apparatus 40 holds the arm 1 at a predetermined position by a detecting signal of the position of the arm 1 detected at 5, thereby weakening the impact of the probe 3.



5: position detector, 66: protruding part, 67: upper part

(51) TESTING APPARATUS FOR WIRING

(11) 3-152482 (A) (43) 28.6.1991 (19) JP

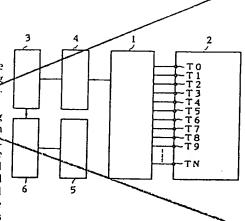
(21) Appl. No. 64 292591 (22) 10.11.1989

(71) FUJITSU AUTOMEKK. (72) YASUHIRO FURUHIRA(I)

(51) Int. Cl⁵. G01R31/02,G0TB21/00

PURPOSE: To make processing easy and with high speeds by allotting the same net number to all the terminals to which a feed shead is transmitted, and storing consecutive terminal numbers in pairs with addresses of a memory means thereby to reduce the memory capacity.

CONSTITUTION: When a signal is sent to one of terminals T (T0-TN) of a testing object 2, a data means 1 reads and scans the terminal connecting data from all of the other terminals to check the transmitting state of the same signal. The same net number is allotted by a test table forming means 4 to the whole terminals to which the same signal is transmitted. The consecutive terminal numbers and consecutive addresses of a test table memory means 3 are stored in pairs in the means 3, thereby forming a test table. Similarly, the terminal connecting data of good perfects are stored as a reference table in a reference table memory means a. An improper connection detecting means 6 compares the test table with the reference table to detect an improper connecting part. By forming such tables, the memory capacity is reduced, and retrieval of connections is made easy.



⑩ 日本 国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-152481

®lnt.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)6月28日

G 01 R 31/00 31/26 7905-2G J 8203-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

フライング・プローブ・ヘッド

②特 願 平1-292762

❷出 願 平1(1989)11月9日

②一発明 者

并 上 博文

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

加出 顧 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

仍代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 相相 👛

1. 発明の名称

フライング・プローブ・ヘッド

2. 特許請求の範囲

 1の揺動アームを一定の位置に保持するように前記第1のムービングコイルを制御し前記第2の揺動アームが下降して前記プローブが前記被検査物のパッドに接触するときプローブの衝撃力を弱めるように前記第1のムービングコイルを制御する制御装置とを含むことを特象とするフライング・プローブ・ヘッド。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はフライング・ブローブ・ヘッド、特に、 半導体を実装する多層配線基板の検査に適用しう るフライング・ブローブ・ヘッドに関する。

〔従来の技術〕

従来のフライング・プローブ・ヘッドは、中央 に平行パネを有し、この平行パネと連接する一端 にプローブを取り付け、他端には磁石とヨークか らなる磁気回路の空隙内を破束と直角な面内で直 線運動するムービングコイルを有した本体と、こ の本体を保持するスライド・レールを含んで 成 される.

次に従来のフライング・プローブ・ヘッドについて図面を参照して詳細に説明する。

第2図は従来のフライング・プローブ・ヘッドの一例を示す斜視図である。第2図においてフライング・プローブ・ヘッドの本体101の中央には平行バネ111が有り、一端にはプローブ103、他端には箱型のムーピングコイル104が取り付けられている。本体101はスライド・レール102に従い矢印Cのように上下の直線運動し、多層配線基板などの被検査物9のパッド10にプローブ103の先端が当たる。ローク152はEの字の右側を上にした形状で、融石150と151はその両側の突起した上部154,155の内側にそれぞれ位置して磁気回路105を構成している。

箱型のムービングコイル 1 0 4 はヨーク 1 5 2 の中央の突起部 1 5 3 を取り巻いていて、その両側のコイルは磁気回路 1 0 5 の空酸内にあるため、
・ムービングコイル 1 0 4 に電流を流すことにより

本発明のフライング・プローブ・ヘッドは第1 のムービングコイルを有し前記第1のムービング コイルに運接した一端に被検査物のパッドに接触 するプローブを設け他端に揺動軸を設けて前記揺 動動を支点にして上下に揺動が可能な第1の揺動 アームと、前記第1の揺動アームの位置を検出す る検出器と、前記揺動軸を中央で保持し一端に観 石とヨークからなり前記第1のムーピングコイル の揺動方向と直角に磁束を与える第1の磁気回路 を有し他媼に第2のムービングコイルを設けて上 下に移動が可能なスライドレールと結合した第2 の揺動アームと、磁石とヨークからなり前記第2 のムーピングコイルの移動方向と直角に磁束を与 える第2の磁気回路を形成する磁気回路部と、前。 配位置検出器からの信号にもとずき前記第しの揺 動アームを一定の位置に保持するように前記第1 のムービングコイルを制御し前記第2の揺動アー ムが下降して前記プローブが前記被検査物のパッ ドに接触するときプローブの衝撃力を弱めるよう に前記第1のムービングコイルを制御する制御装

本体101を駆動出来る。平行バネ111は、プローブ103がパッド10に接触して一定量携みプローブ103の先端に一定のプロービング圧力を付加する。また、プローブ103がパッド10に当たるときの衝撃力を緩衝させてパッド10の損傷を防止している。しかし、上下速度を大きくするとパッド10へ当たる衝撃が大きくなり、平行バネ111が撓んで緩衝させても損傷は防止できない。

すなわち、平行パネ111の力の強さは一定の ブロービング圧力を発生させるため一定の固定さ れた強度がありパッド100の損傷を除去でする ことは困難であって、従来は上下速度を大きくす るとブローブ103の先端がパット10に大きな 損傷を与えていた。

[発明が解決しようとする課題]

上述した従来のフライング・プローブ・ヘッドは、プローブの上下速度を大きくすると被検査物パットの大きな損傷を与えるという欠点があった。

〔謀題を解決するための手段〕

置を含んで構成される。

(実施例)

次に、本発明の実施例について、図面を参照して詳細に説明する。

第1図は本発明の一実施例の構成を示す斜視図である。第1図に示すフライング・プローブ・ヘッドは、揺動アームが揺動軸2の同りに図中矢印Aのように揺動であり、また、揺動アーム1の位置を位置検出器5が検出する。揺動アーム1の位置を位置検出器5が検出する。揺動アーム1の応端にはプローブ3、他端の括けられている。磁石51,52はムーピングコイル41の両部64,65の側面に保持され、磁気回路55を構成する。ヨーク61の中央の突起部63を取りたムーピングコイル41は、電流を流すことにより揺動軸2を支点に上下に揺動が可能となってより

括動アーム 6 は、先端に磁気回路 5 5 を構成する る磁石 5 1 と 5 2 を保持したヨーク 6 1 と中央に

特開平3-152481(3)

は揺動軸2がそれぞれ設けられ、他端にはムービングコイル42が設けられている。そして、ムービングコイル42の一方端はスライドレール7に固定されて、揺動アーム6は矢印日に示すように上下に移動が可能となっている。豆型形状のヨーク62は両端の上部67,68の内側に破石53、54がそれぞれ設けられ破気回路56を構成し、また、この磁気回路56の空隙内の破束と直角に、前記ョーク62の中央の突起部66に外挿されて前記ムービングコイル42に電流を流すと矢印Bに示す方向に揺動アーム6は駆動される。

制御装置40は、配線 a によりムービングコイル41に、配線 b により位置検出器 5 にそれぞれ接続されている。そして、制御装置40は、位置検出器 5 からの信号にもとずさ、ムービングコイル41に流す電流を制御して揺動アーム 1 を一定の位置に保持している。また、揺動アーム 6 が下降してブローブ3の先端が被検査物 9 のバッド10に接触するときは、衝動力を弱めるようにムービ

めることができるため、パッドに損傷を与えない という効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す斜視図、第2 図は従来の一例を示す斜視図である。

1.6……揺動アーム、2……揺動軸、3.103……プローブ、41,42.104…… ムーピングコイル、5……位置検出器、55,56. 105……磁気回路、7,102……スライド レール、9……被検査物、10……パッド、 51,52,53,54,150,151……磁 石、61,62,152……ヨーク、101……

a, b……配線、A,B,C……矢印。

代理人 弁理士 内 原 督

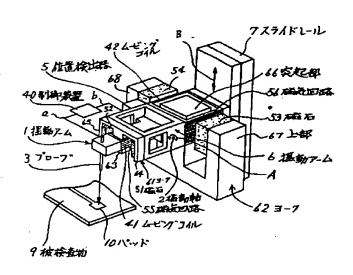
ングスタイル41への電流を制御し、接触後は一定の電流でムービングコイル41を駆動し、プローブ3に確実に接触するように一定のプロービング圧力を付加している。検査が終了し活動アーム6が上昇すると、制御装置40は位置検出5からの信号にもとずき、再び活動アーム1をもとの一定の位置に復帰させる。

上述してわかるように、プローブ3の先端がパッド10に接触するとき、衝撃力を弱めるようにムービングコイル41を制御し、接触後は一定のプロービング圧力を付勢するように制御しているので、高速で動作させてもパッド10を損傷させることがなく、しかも、確実にプローブ3をパッド10に接続できる。

〔発明の効果〕

本発明のフライング・プローブ・ヘッドは、平 行パネを設ける代りに、磁石とロークからなる磁 気回路の空間内に磁束と直角に揺動可能な第1の ムービングロイルを設けることにより、プローブ が被検査物のパッドに接触するときの衝撃力を弱

差 1 图



第 2 图

